

微电子材料检测-材料分析及检测-检测服务检测

产品名称	微电子材料检测-材料分析及检测-检测服务检测
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供微电子材料检测-材料分析及检测-检测服务检测、微电子材料检验、微电子材料第三方检测、微电子材料质检报告、微电子材料计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 半绝缘砷化镓单晶中碳浓度的红外吸收测试方法 GB/T 19199-2015 半绝缘砷化镓单晶中碳浓度

2 硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法 GB/T 1553-2009 少子寿命

3 工业硅化学分析方法 第4部分：杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 14849.4-2014 工业硅中杂质元素含量

4 半导体单晶晶向测定方法 GB/T 1555-2009 晶向

5 硅片弯曲度测试方法 GB/T 6619-2009 晶片弯曲度

6 硅片翘曲度非接触式测试方法 GB/T 6620-2009 晶片翘曲度

- 7 掺硼掺磷掺砷硅单晶电阻率与掺杂剂浓度换算规程 GB/T 13389-2014 电阻率与掺杂剂浓度换算
- 8 砷化镓单晶AB微缺陷检验方法 GB/T 18032-2000 砷化镓单晶AB微缺陷
- 9 半绝缘砷化镓单晶深施主EL2浓度红外吸收测试方法 GB/T 17170-2015 砷化镓单晶EL2浓度
- 10 砷化镓单晶位错密度的测量方法 GB/T 8760-2006 砷化镓单晶位错密度
- 11 砷化镓、磷化铟半导体材料参数测试方法 SJ 3244.1-1989 砷化镓和磷化铟材料霍尔系数
- 12 砷化镓单晶材料测试方法 GJB 1927-1994 方法104 砷化镓材料杂质均匀性
- 13 半绝缘砷化镓剩余杂质浓度微区试验方法 SJ 20635-1997 方法101 砷化镓材料杂质浓度
- 14 半绝缘砷化镓剩余杂质浓度微区试验方法 SJ 20635-1997 方法102 砷化镓材料杂质浓度
- 15 半绝缘砷化镓剩余杂质浓度微区试验方法 SJ 20635-1997 方法104 砷化镓材料杂质浓度